

圖 13-26 不同狀況下的氧化層測試鍵結構示意圖。

**Oxide Leakage:**

Measure  $I_G$  with  $V_G = 0 \sim -15V$  (P-sub),  $V_B = 0V$  (Accumulation)

**Oxide Breakdown Voltage:**

Search  $BVG_{OX} = V_G$ , when  $I_G = -1\mu A$

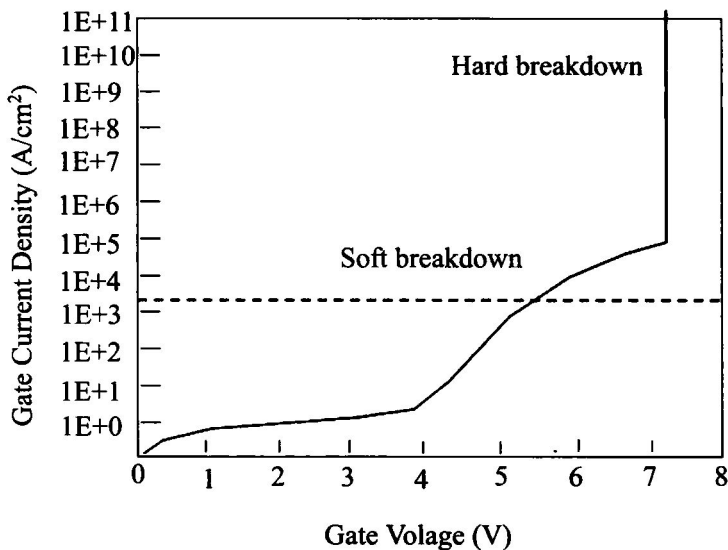


圖 13-27 典型氧化層漏電流與崩潰電壓測試結果。